

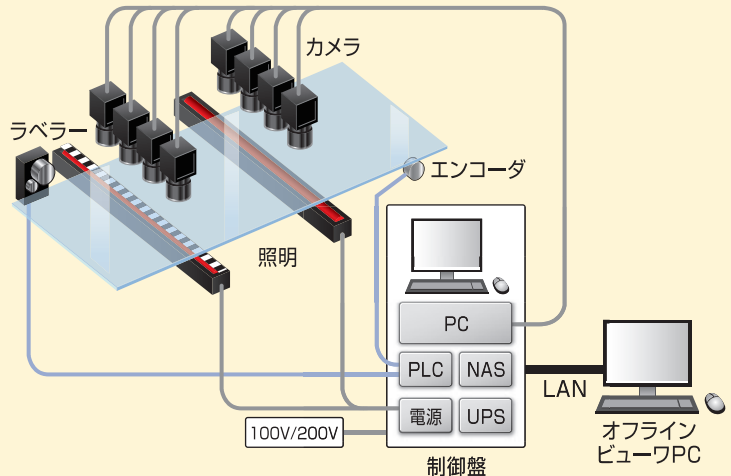
Film Inspection System

長年培ってきた光学系技術と画像処理技術を融合し、
お客様が実現したい最適な自動検査機能を提供します。

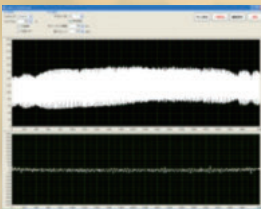
特 徴

- 1** 使い勝手を追求した高機能標準ソフトを搭載することで、検査機システムの導入を容易にします。更に、ビューア機能、多変量解析機能も準備しております。
- 2** サンプルテストや各種条件から、最適な光学系のご提案をします。光学歪み検査においては当社の得意とするモアレ縞方式により高感度な検出が可能となります。
- 3** 標準化ソフトをベースとすることで、高いコストパフォーマンスを実現しました。

システム構成例(透過モアレ+明視野透過) 歪み欠陥と異物系欠陥の検査・識別が可能

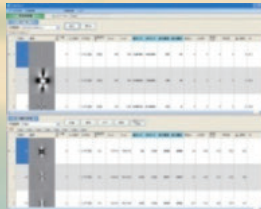


各種画面



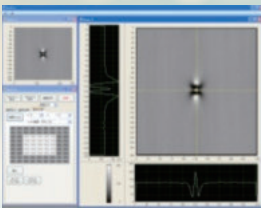
カメラ調整画面

ラインセンサーカメラの入力波形表示の画面です。拡大縮小が自由にでき1画素単位の調整が可能です。



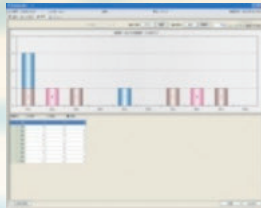
識別パラメータ作成画面

多変量解析機能の基準データ作成を支援する画面です。人間の判断基準に近い欠陥識別を可能にします。



欠陥解析画面

欠陥のサイズ解析や検査基準の設定をシミュレーションする画面です。



欠陥分布グラフ

欠陥分布の表示画面です。モード切り替えにより様々な条件での分布グラフ表示が可能です。

仕 様

カメラ台数	16台/1PC(40台/システム実績有り)
入力系列	2系列/1PC(7系列/システム実績有り)
対応カメラ	モノクロラインセンサー(カメラリンク規格)
IF	同期エンコーダ入力 ライン制御とのIF通信およびDIO LAN共有ファイルによる欠陥情報通信 ラベラー出力 警報出力
光学系	透過モアレ 反射モアレ 明視野透過 暗視野透過 明視野反射 暗視野反射 半明視野 スリット照明 他
検査アプリケーション	オンライン検査 カメラ調整 画像取込・解析機能 パラメータ設定 欠陥識別機能
ビューワ機能(オプション)	欠陥マップ表示 欠陥トレンド表示 欠陥分布グラフ表示 欠陥画像表示 各種印刷機能 各種ファイル保存機能
多変量解析シミュレータ(オプション)	欠陥登録機能 識別パラメータ作成機能 識別欠陥確認機能

製造元



株式会社ケー・デー・イー

<http://www.kde.co.jp/>

ナノスコープ事業部 / 大阪市淀川区西宮原1丁目8番24号 新大阪第3ビル5階
TEL(06)4807-7774 FAX(06)4807-7775
E-MAIL: info@kde.co.jp

販売元



芳賀電機株式会社

<http://www.haga.co.jp/>

本 社 / 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目21-7
TEL(06)6385-3831代 FAX(06)6385-8497
東京支店 / 〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目16-9 センタービル9階
TEL(03)3256-1421代 FAX(03)3256-1422

製品に関するお問い合わせは **検査機担当**(中塚) **TEL(06)6385-3831** E-MAIL: kensaki@haga.co.jp